

SCAN TECH 2017のお知らせ

2017/6

公益社団法人 日本顕微鏡学会
走査電子顕微鏡分科会

今年度は、「SEM 可視化技術の最前線～観察試料の多様性に応える前処理・後処理技術の今！～」をテーマとして SCAN TECH 2017 を開催することになりました。各分野の最前線でご活躍の方々に講演をお願い致しました。具体的な内容は次項のプログラムをご覧ください。さらに、講演会終了後のポスターセッション&フリートークキングでは、講師やスタッフあるいは参加者同士が自由に討議できる時間を確保してあります。

記

- 主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会
- 日時：2017年9月15日（金） 10:00～18:30
- 場所：東京都市大学 世田谷キャンパス（東京都世田谷区玉堤 1-28-1）
講演会場は3号館4階のメモリアルホールです。
※例年と会場が異なりますのでご注意ください。
交通
 - 東急大井町線 尾山台下車：徒歩12分
 - 東急東横線/東急多摩川線 多摩川駅下車→東急バス（二子玉川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩3分
 - 東急田園都市線 二子玉川駅下車→東急バス（多摩川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩3分
 - 東急東横線 田園調布駅下車→東急バス（千歳船橋駅行）東京都市大北入り口下車：徒歩5分
- 参加費（予稿集代を含む）
事前登録者： 3,500円（日本顕微鏡学会会員）、5,500円（一般）
当日登録者： 4,000円（日本顕微鏡学会会員）、6,000円（一般）
学 生： 無料（学生証を御提示ください。）
*申し込みの際、日本顕微鏡学会会員の方は、会員番号もお知らせください。但し、御所属の機関が法人会員でも、個人は会員扱いになりませんのでご了解願います。
- 登録および参加費振り込みについて
 - 登録&振り込み締め切り：2017年8月25日（金）
 - 登録方法：分科会ホームページ：<http://scantech.jp>
(Webを利用できない方はE-mailでお願いします)
 - E-Mailでの申し込み先：
東京工業大学 地球生命研究所(ELSI) 米光 恭子
〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1-I7E-214
E-Mail：yonemitsu@elsi.jp
 - 振込先：三菱東京UFJ銀行 秋葉原支店
口座名 公益社団法人 日本顕微鏡学会 会長 田中 信夫
口座番号 (普) 1094816
*8/26(土)以降の振込、および当日のお支払いは当日登録扱いの金額となりますのでご注意ください。
*クレジットカード決済には対応していませんのでご了承ください。
*念のため、当日は振込領収書(コピー可)をお持ちください。

周囲に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。

なお、最新の情報は走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL：<http://scantech.jp>

来年度の案内をE-mailでご希望の方は、inazato.sachiko@jp.panasonic.comまでご連絡下さい。

SCAN TECH 2017

SEM 可視化技術の最前線 ～観察試料の多様性に応える前処理・後処理技術の今！～

日時：2017年9月15日（金）10:00～18:30
場所：東京都市大学 世田谷キャンパス

1. 開会挨拶 稲里幸子（パナソニック）
2. SEM 像形成の基礎 中畠香織（日本電子）
3. EDX による組成分析-手法の基礎と測定時の留意点 原 徹（物質・材料研究機構）
4. 光電子相関法（CLEM）の基礎と応用 豊岡公德（理化学研究所）
5. 軟 X 線発行分析の基礎とバルク状態分析 寺内正巳（東北大学）
6. NanoSuit 法と EDS 観察法の併用による生物の低処理元素分析 針山孝彦（浜松医科大学）
7. ポスター&休憩
 - ・真の姿をみるための前処理・観察技術 藤本亜由美（カネカテクノリサーチ）
 - ・引張変形下における微細粒ステンレス鋼の組織解析 松尾卓、石田喬一、今福宗行（東京都市大学）
 - ・Fe-Mn-Si-Cr 系合金の変形・熱処理における組織・相硬度解析 石田喬一、伊藤薫平、今福宗行（東京都市大学）
8. FE-SEMにおけるその場観察技術 岡本嘉紀（コベルコ科研）
9. FIB-SEM装置による無機材料の解析例 加藤丈晴（ファインセラミックスセンター）
10. 電子顕微鏡画像の画像解析と定量化 池崎満里子（日本ローパー）
11. 閉会挨拶 乙部博英（旭化成）
12. ポスターセッション&フリートーキング

ポスターセッション&フリートーキングの場では、演者に講演内容のポスターを提示していただき、それを見ながら個別に技術交流することができます。

奮ってご参加下さい。

上記プログラムは暫定のものです。演題、演者は変更になる可能性があります。

最新情報は、走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL : <http://scantech.jp>